

研究会資料の作成見本

(付録 2)

上余白 40mm

(1) シールドドロープコイルを用いた 1MHz - 1.5GHz 帯における

磁性薄膜のパーミアンス計測

1行アキ 氏名 12P

(2) 電気太郎*, 学会二郎, 研究花子 (日本電機大学), 電力三郎 (日本電力)

1行アキ

Thin-Film Permeance Measurements Using Shielded Loop Pickup Coil in the 1MHz-1.5GHz Range.

(3) Taro Denki, Jiro Gakkai, Hanako Kenkyu (Nihon Denki University) 英文氏名 9P
Saburo Denryoku (Nihon Electric Power Company)

1行アキ 英文概要 9P
Abstract

We have developed a permeance meter in the 1MHz-1GHz range using shielded loop pickup coil and micro-strip pickup coil. We must consider all of signal-to-noise ratio in the MHz range, impedance matching through-out the driving plates and pickup coil, mode matching of pickup coil, electromagnetic mode in driving plates, induced voltage by electric field.

1行アキ

キーワード: パーミアンス, 平行平板励磁コイル, シールドドロープコイル, 電界 和文キーワード 9P
(Permeance, parallel plates, driving plates, shielded loop coil, electric field) 英文キーワード 9P

1行アキ

1. はじめに 広帯域にわたるパーミアンスの測定が可能となったので報告する。

磁性薄膜の高周波パーミアンス (透磁率の平均値と膜厚との積) は薄膜磁気ヘッド, 薄膜電源, 携帯電話用 LC フィルタ等マイクロ磁気デバイスの設計, 評価に不可欠な量である。また

2. GHz までのパーミアンス測定に関する課題

図 1 は LC 共振を用いたスナバエネルギーの回生回路を示すものである。この回路において, Cs と Ds は従来どおりスナバコンデンサ, スナバダイオードであり

は

は

は

は

は

は

は

は

は

は

は

は

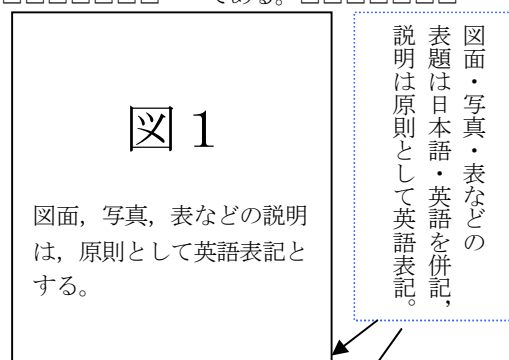
は

左余白 16mm

右余白 16mm

マージン 10mm

片段 26 字, 84mm



図面, 写真, 表などの説明は, 原則として英語表記とする。

図面・写真・表などの説明は 日本語・英語を併記, 説明は原則として英語表記。

図 1 スナバエネルギー回生回路
Fig. 1 A snubber energy recovery circuit

最終ページ

Placeholder text for the left column, consisting of multiple lines of empty boxes.

Placeholder text for the right column, consisting of multiple lines of empty boxes, ending with a reference section header.

(1) 日本語論文などの場合 (英語・日本語の併記)
T. Denki, M. Hanai and G. Misaki: "Future Technology for Power System Analysis", T.IEE Japan, Vol.130-B, No.1, pp130-136(1999-1) (in Japanese)
電気太郎・花井桃子・岬 五郎:「電力系統解析技術の将来」, 電学論B, 130, 1, pp.130-136 (1999 - 1)

(2) 国際会議などの論文集の場合
B.Yamada: " Experimental Studies of new micro-mechanical vibration systems" ,Proc. IEEE Conf. on Micro-mechanical Component, No21, pp.123 - 145, Paris, France(1999-4)

(3) 単行本などの場合
Y. Sankar: Management of Technological Change, p.10, John Wiley, New York(1991)